SiC_f/Ti60 复合材料的热稳定性

孔 旭,王玉敏,张 旭,杨 青,张国兴,杨丽娜,杨 锐

(中国科学院金属研究所, 辽宁 沈阳 110016)

摘 要: 对采用磁控溅射先驱丝工艺制备的 SiC_f/Ti60 复合材料进行不同温度下长时间热暴露实验,分析了热等静压态和热暴露态复合材料界面区结构稳定性及元素扩散规律。研究结果表明,SiC 纤维中 C、Si 元素和 Ti60 基体中 Ti 及其它合金元素进行互扩散;界面反应层主要产物为 TiC,TiC 层外侧环绕着一层硅化物;基体中的 TiC 主要集中分布在 a 钛晶界处。SiC_f/Ti60 复合材料反应层厚度长大受扩散控制并与温度的关系遵循阿伦尼乌斯规律,界面反应层长大指数 因子为 2.27×10⁻⁴ m/s^{1/2},界面反应层长大激活能为 118 kJ/mol。

关键词:复合材料;热稳定性;SiC纤维;Ti60;界面反应

中图法分类号: TB333 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2017)S1-071-05

连续 SiC 纤维增强钛基复合材料(TMCs)沿纤维方 向具有高比强度、高比模量和优异的抗疲劳与抗蠕变性 能,已经成为新一代高推重比航空发动机的关键材料之 一^[1-3]。美国在高性能涡轮发动机综合技术(IHPTET) 计划的推动下,已经制备出空心叶片、压气机转子、叶 环、 连接件等部件, 部分构件在 F-22 战斗机上已经 实现应用^[2]。自 20 世纪 80 年代起,关于 TMCs 的研究 主要集中在纤维增强 β 和 $\alpha+\beta$ 钛合金上。随着航空发 动机压气机使用温度的不断提高,国外开展了 SiC 纤维 增强近α高温钛合金的研究工作,部分研究工作重点关 注该类复合材料的界面热稳定性^[4]。因为复合材料在前 期制备和后期服役过程中,界面反应层会长大,如果控 制不当会导致复合材料内部形成裂纹源,严重降低复合 材料力学性能。英国 M. Thomas 等^[5]研究发现, Sigma 碳化硅纤维增强 IMI834 复合材料比增强 Ti-6Al-4V 复 合材料需要更高的热压成型温度,所以其界面反应层更 厚。德国 H. Dudek 等^[6]研究了 SCS-6 纤维增强 IMI834 复合材料在长时间热暴露实验后的热稳定性,并利用透 射电镜分析了热暴露实验后复合材料界面产物,发现界 面反应层由 TiC 和硅化物构成。

我国 TMCs 的研究起步较晚,从 20 世纪末开始, 中国科学院金属研究所、北京航空材料研究院和西北 工业大学等相继开展了碳化硅纤维制备和纤维增强β 和 α+β 钛合金等研究工作,其中中国科学院金属研究 所针对不同的应用背景,开展了使用温度范围在 350~800 ℃之间的钛基以及钛铝基复合材料研究工 作^[7]。Ti60 合金是我国自主研制使用温度达 600 ℃的 高温钛合金,合金电子浓度设计值 2.14~2.15,优化 后合金名义成分为 Ti-5.7Al-4.0Sn-3.5Zr-0.4Mo-0.4Si-0.4Nb-1.0Ta-0.05C,已经进入应用考核阶段,其可以 作为 TMCs 的基体合金在 600 ℃下长时间使用。目 前国内尚未开展关于 SiC_f/Ti60 复合材料界面热稳定 性系统的研究工作。为评估该类复合材料在 600 ℃甚 至更高温度长时服役下的界面稳定性,本实验选取利 用磁控溅射先驱丝工艺制备的 SiC_f/Ti60 复合材料, 研究不同热暴露温度下复合材料界面区的热稳定性 和界面反应层长大规律,并且利用电子探针技术 (EMPA)分析 SiC_f/Ti60 复合材料在热暴露实验后元素 分布及扩散规律。

1 实 验

本实验选取中国科学院金属研究所采用化学气相 沉积法(CVD)制备的连续钨芯碳化硅纤维,利用磁控溅 射技术在碳化硅纤维表面沉积 Ti60 合金涂层,制备出 SiCf/Ti60 复合材料先驱丝。将复合材料先驱丝排布封 装在圆柱形钛合金包套内,再经热等静压成型,制备出 复合材料棒状样品。为研究复合材料界面热稳定性,对 复合材料样品进行热暴露实验。具体实验过程如下:将 复合材料棒材切成 5 mm 厚样品,装入石英管真空密封 后分别在 600、700、800 和 900 ℃进行热暴露,每个温 度下热暴露时间分别为 100、200、300 和 400 h。热暴 露后的样品磨平抛光腐蚀后利用 Inspect F50 场发射扫 描电镜观察样品形貌并测量复合材料界面反应层厚度; 利用日本理学D/Max-2400 型 X 射线衍射仪对样品进行

收稿日期: 2016-12-13

作者简介:孔 旭,男, 1991年生,博士生,中国科学院金属研究所,辽宁 沈阳 110016,电话: 024-83978948, E-mail: xkong13s@imr.ac.cn

物相分析;利用日本电子 JXA-8230 型电子探针分析仪 对复合材料样品中元素分布进行分析。

2 结果与讨论

2.1 复合材料界面区微观形貌和物相构成

图 1 为 SiC_f/Ti60 复合材料热等静压态和 700℃/400h热暴露后样品在扫描电镜下的微观形貌。 如图1所示,热等静压态样品界面区沿纤维径向从内 到外依次是碳化硅、碳涂层、TiC反应层和α钛,在 图1b中可以清晰地观察到700℃/400h热暴露后基体 合金中TiC集中分布在α钛晶界。

利用 X 射线衍射仪对不同温度热暴露样品进行物 相分析的结果如图 2 所示。不同热暴露温度下样品 X 射线衍射峰位置基本相同,物相分析均为 β 碳化硅、



图 1 SiC_f/Ti60 复合材料界面区微观形貌

Fig.1 SEM images of the interface of SiC_f/Ti60 composites: (a) as-processed and (b) treated at 700 \degree C for 400 h



图 2 不同温度热暴露实验后 SiC_f/Ti60 复合材料的 XRD 图谱 Fig.2 XRD patterns of SiC_f/Ti60 composites after thermal exposure at different temperatures

TiC 和 α 钛。其中 β 碳化硅衍射主峰(111)在图 2 中没 有出现,这是由于化学气相沉积中 β 碳化硅的密排面 为(111)面, β 碳化硅沿纤维径向生长,严重的择优取 向导致衍射主峰消失。碳化硅(100)衍射峰的出现表明 β 碳化硅生长过程中出现了堆垛层错,这与拉曼光谱 和透射电镜结果相一致^[8]。Ti60 是一种近 α 高温钛合 金,衍射图谱中仅得到 α 钛高强度衍射峰,这是由于 复合材料热等静压温度低于 Ti60 合金 $a/a+\beta$ 转变温 度。热暴露温度的提高有利于界面反应层和 α 钛晶界 处的碳化钛长大,900 °C/400 h 热暴露后样品在衍射 角 60°附近出现明显的双峰现象,这是碳化钛(220)衍 射峰与碳化硅(220)衍射峰位置重叠造成的。

2.2 热暴露后复合材料界面区元素分布

利用 JXA-8230 型电子探针分析仪在 20 kV 加速 电压下测得热等静压态 SiC_f/Ti60 复合材料界面区元 素面分布,如图 3 所示。电子探针分析点数量为 300 ×300。碳元素集中分布在纤维表面碳涂层和界面反应 层,此外在基体合金也出现了一些零星分布,这是 Ti60 合金原有碳化物所致。钛元素在图 3c 中出现了颗粒状 贫瘠区,这是 Ti60 合金硅化物析出所致,从图 3d 硅 元素的分布可以得到验证。硅元素主要分布在碳化硅 纤维内部和界面反应层以及 Ti60 硅化物的析出处。 锆、铝和锡集中分布在基体合金 a 相,在热等静压态 样品中没有发现明显富集区域。钼元素在 Ti60 合金中 含量比较低,受仪器分辨率等因素限制,其在 SiC_f/Ti60 复合材料界面区分布规律还需要进行深入的研究。

图 4 为 900 ℃/400 h 热暴露样品元素面分布图。 电子探针分析点数量同样为 300×300。相比热等静压 态样品,900 ℃/400 h 热暴露后样品纤维碳涂层已经消 耗殆尽,界面反应层厚度增加,这是由于热暴露温度 的提高有利于碳元素快速扩散到界面区生成更多的 TiC。900 ℃/400 h 热暴露样品中碳元素在基体合金中 形成大量块状和长条状的富集区,这是由于热暴露温 度的提高有利于基体合金 α 相晶界处 TiC 析出,长时 间热暴露后, TiC 长大团聚并向 α 相内部扩展。钛元 素集中分布在基体合金 α 相中,向纤维内部扩散非常 缓慢。在图 4d 中可以看到, 硅元素在界面反应层外侧 出现富集区,相比热等静压态样品,基体合金内部硅 元素富集区数量增多、面积增大,这是由于热暴露温 度升高有利于(Ti, Zr),Si,的生成和长大^[6]。锆元素在基 体合金中的富集区与硅元素富集区相吻合,在背散射 电子下可以观察到白色硅化物颗粒沿界面反应层外侧 和 α 相晶界分布。铝和锡元素集中分布在基体合金 α 相, 与热等静压态样品类似, 900 ℃/400 h 热暴露样品 没有发现铝和锡扩散到纤维内部。



图 3 SiCf/Ti60 复合材料热等静压态样品元素面分布





图 4 900 ℃/400 h 热暴露 SiC_f/Ti60 复合材料元素面分布

2.3 界面反应层长大规律

根据图 3a、图 1b 和图 4a 所示可知,随着热暴露 温度提高和时间增长,复合材料界面反应层厚度逐渐 增加。在 SiC_f/Ti60 复合材料热暴露实验中,反应层厚 度长大规律可以用扩散模型描速,反应层厚度与热暴 露时间的关系如下:

$$x = x_0 + kt^{1/2} \tag{1}$$

x 表示反应层厚度, x₀表示初始反应层厚度, k 表示界 面反应层长大速率常数, t 表示热暴露时间。图 5 给出 了不同温度下反应层厚度与时间的关系曲线。Ti60 作 为一种设计在 600 ℃长时间使用的高温钛合金, 其复

^{Fig.4 EPMA element maps of SiC_f/Ti60 exposed at 900 °C for 400 h: (a) microscopic morphology, (b) C, (c) Ti, (d) Si, (e) Zr, (f) Al, (g) Sn, and (h) Mo}





合材料在 600 ℃下界面的热稳定性是该材料作为复合 材料基体实现应用的前提。根据图 5 所示,热等静压 态复合材料界面反应层初始厚度为 0.87 µm。在 600 ℃ 热暴露实验中,界面反应层厚度相比热压态没有明显 增加,这表明 SiCf/Ti60 复合材料在 600 ℃长时间热暴 露下界面稳定性良好。在 700 ℃热暴露实验中,界面 反应层厚度增长缓慢,400 h 后反应层厚度仅长大到 0.94 µm,反应层厚度长大速率常数经计算为 9.57×10⁻¹¹ m/s^{1/2}。在 800 ℃热暴露实验中,复合材料 界面反应层厚度长大速率相比 700 ℃明显加快,反应 层厚度长大速率常数为 4.18×10⁻¹⁰ m/s^{1/2}。在 900 ℃热 暴露实验中,由于温度提高有利于碳元素快速扩散至 基体合金并生成 TiC,所以反应层厚度长大速率进一 步加快,原始碳层消耗殆尽,反应层厚度长大速率常 数为 1.15×10⁻⁹ m/s^{1/2}。

在 SiC_f/Ti60 复合材料热暴露实验中,反应层厚度 长大速率常数与热暴露温度的关系可以用阿伦尼乌斯 关系描速^[9]:

$$\ln k = \ln k_0 - \frac{Q}{RT} \tag{2}$$

其中, k_0 为指数因子,Q为界面反应层长大激活能,R为气体常数,T为热暴露温度。不同热暴露温度下界面反应层厚度长大速率常数与热暴露温度的关系如图 6 所示。根据式(2)计算可得 SiC_f/Ti60 界面反应层长大激活能为 118 kJ/mol, k_0 为 2.27×10⁻⁴ m/s^{1/2},与SiC_f/TC17 复合材料界面反应层长大激活能 Q=138kJ/mol^[10]相比稍低。这是由于 SiC_f/TC17 复合材料基体合金,从而增加了复合材料界面反应层长大激活能。



- 图 6 SiC_f/Ti60 复合材料界面反应层厚度长大速率常数与热暴 露温度的阿伦尼乌斯关系
- Fig.6 Arrhennius plot for the growth rate parameter of the interfacial reaction layers thickness with thermal exposure temperature of SiC_t/Ti60 composites

3 结 论

1)SiC_f/Ti60 复合材料在热等静压过程中,Ti60 基体合金与纤维碳涂层生成TiC反应层,TiC层外侧 环绕着一层硅化物。界面反应层和基体合金α相晶界 处的TiC随着热暴露温度升高而长大。

2)SiC_f/Ti60复合材料在 600 ℃热暴露实验中反应层厚度没有明显长大,为SiC_f/Ti60复合材料在该温度下的长时服役提供了实验数据支撑。

3) SiC_f/Ti60 复合材料界面反应层长大受扩散控制,反应层长大激活能为 118 kJ/mol。

参考文献 References

- [1] Yang Rui (杨 锐), Shi Nanlin(石南林), Wang Yumin(王玉敏) et al. Titanium Industry Progress (钛工业进展) [J], 2005, 22(5): 32
- [2] Hooker J, Doorbar P. Mater Sci Technol[J], 2000, 16(16): 725
- [3] Zhou Yigang(周义刚), Yang Yanqing(杨延清). Acta Metallurgica Sinica (金属学报) [J], 2002, 38(S1): 461
- [4] Lv Xianghong(吕祥鸿) Yang Yanqing(杨延清) Ma Zhijun(马志军) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程) [J], 2006, 35(1): 164
- [5] Thomas M, Winstone M, Robertson J. J Mater Sci[J], 1998, 33(14): 3607
- [6] Dudek H, Borath R, Leucht R et al. J Mater Sci[J], 1997, 32(20): 5355
- [7] Wang Yumin(王玉敏), Xiao Peng(肖 鹏), Shi Nanlin(石南林) et al. Materials China (中国材料进展) [J], 2010, 29(5): 9

[8] Ward Y, Young R, Shatwell R. J Mater Sci[J], 2001, 36(1): 55

[9] Martineau P, Lahaye M, Pailler R et al. J Mater Sci[J], 1984, 19(8): 2731 [10] Zhang Xu(张 旭), Wang Yumin(王玉敏), Yang Qing(杨 青) et al. Acta Metallurgica Sinica (金属学报) [J], 2012, 48(11): 1306

Thermal Stability of SiC_f/Ti60 Composites

Kong Xu, Wang Yumin, Zhang Xu, Yang Qing, Zhang Guoxing, Yang Lina, Yang Rui (Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China)

Abstract: Thermal stability of SiC_f/Ti60 composites under thermal exposure at different temperatures was studied. Interfacial reaction layer and element diffusion of SiC_f/Ti60 composites after hot isostatic pressing and thermal exposure were also investigated. The results show that the interdiffusion of C or Si in SiC fiber and Ti or other elements in the matrix occurs. The main product of reaction layer is TiC at the interface and the outer layer of the TiC layer is surrounded by $(Ti, Zr)_x Si_y$. TiC mainly exists on the grain boundaries in the matrix. The thickness growth behavior of SiC_f/Ti60 composites reaction layer is influenced by diffusion and follows an Arrhenius law with temperature. The preexponential factor and the activation energy of SiC_f/Ti60 composites are $2.27 \times 10^{-4} \text{ m/s}^{1/2}$ and 118 kJ/mol, respectively. **Key words:** composites; thermal stability; SiC fiber; Ti60; interfacial reaction

Corresponding author: Wang Yumin, Ph. D., Associate Professor, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, P. R. China, Tel: 0086-24-83978948, E-mail: yuminwang@imr.ac.cn